

実用 SEM セミナー 2016 開催のご案内

新製品開発や商品の品質管理において、走査電子顕微鏡 (SEM) などによる表面観察や成分分析は、その商品の現状を確認するために欠かせない手段の一つです。八戸インテリジェントプラザでは走査電子顕微鏡を保有し、製品の観察や分析にご利用頂いております。

今年も、世界屈指の電子顕微鏡メーカーである、日本電子株式会社にご協力を頂き、実用 SEM セミナー 2016 を開催することになりましたので、ご案内させていただきます。

本セミナーでは、電子顕微鏡の基礎的知識を学ぶ「SEMの基本と応用例」そして、表面分析の一種である「オージェ電子分光分析法 (AES) の基礎と応用」について、ご講演いただきます。走査電子顕微鏡初心者の方から、より高度な表面分析手法にご興味をお持ちの方まで、ご参加いただける内容となっております。

なお、毎年恒例となっております実機見学では、当社所有の高分解能ショットキー型フィールドエミッション走査電子顕微鏡 (JSM-7600F) のほか、日本電子製卓上走査電子顕微鏡 (JCM-6000Plus) とハイロックスジャパン製のデジタルマイクロスコープ (RH-2000) のデモンストレーションをご覧いただけます。皆様のご参加をお待ちしております。

※実機見学では、参加者の皆様に実際に装置を操作体験していただけます。

開催日時：2016年9月13日(火) 13:30～17:00
(セミナー 13:30～15:30 実機見学 15:30～17:00)

場所：八戸インテリジェントプラザ アイピーホール

講師：日本電子株式会社

アプリケーション統括室バイオ 3D 推進グループ グループ長 高島 良子 氏
スキャニング系事業部門 SA 事業ユニット SA アプリケーション部 主査 堤 建一 氏

定員：15名

参加料：無料

申込先：株式会社八戸インテリジェントプラザ 担当：林崎

申込方法：下記の「受講申込書」により

9月8日(木)までに「FAX」等にてお申し込みください。

実用 SEM セミナー 2016 受講申込書

FAX 送信先 **0178-21-2119**

貴社(機関)名

(発信者氏名： TEL -)

所属名	参加者氏名